E Recidition

特 許 協 力 条 約

PCT

## 国際予備審査報告

REC'D 1 3 MAY 2004

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 13981 0 941	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。						
国際出願番号 PCT/JP03/05779	国際出願日 (日.月.年) 08.05.03	優先日 (日.月.年) 23.07.02					
国際特許分類 (IPC) In	t. C1' G02B6/36						
出願人(氏名又は名称) 湖北工業株	式会社						
2. この国際予備審査報告は、この表	紙を含めて全部で3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
この国際予備審査報告には、附属審類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。     (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属審類は、全部で ページである。							
この国際予備審査報告は、次の内容を含む。							
国際予備審査の請求むを受理した日	国際予備審:	<b>査報告を作成した日</b> 21.04.04					
18.12.03 名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J 郵便番号100-891 東京都千代田区霞が関三丁目	特許庁審査' P) 5 4番3号	日夏 貴史 2K 9411 内線 3253					

I. 国際予備審査報告の基礎						
1.	この国際予備審 応答するために PCT規則70.1	<b>ニ提出された差し替え用紙</b> ト	こ基づいて作成され は、この報告書にお	ιた。(法第6条(PCT 3いて「出願時」とし、本	14条)の規定に基づく命令に 報告書には添付しない。	
X	出願時の国際	光出願書類				
	別知告明知告明知告明知告。 明知告明知告	第 第 第 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と		
	] 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第 第	項、 項、 	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基 国際予備審査の請求書る	甚づき補正されたもの	
	回図面 図面 図面	第 第 	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書。 	の と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの	
	明細書の配列	列表の部分 第 列表の部分 第 列表の部分 第	ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書		
2.	上記の出願書類	頃の言語は、下記に示す場	合を除くほか、こ	の国際出願の官語である。	,	
上記の書類は、下記の言語である 語である。  □ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 □ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 □ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語						
3.	ここのの国際後に出版際後に出版原象後に出版原のの国際後に出版のの国際を記しませます。	条出願に含まれる書面によ 条出願と共に提出された磁 こ、この国際予備審査(ま こ、この国際予備審査(ま こととといる。 と と と と と と と と と と と と と	る配列表 気ディスクによる配 たは調査)機関に たは調査)機関に 表が出願時における と磁気ディスクに、	記列表 是出された書面による配列 是出された磁気ディスクし る国際出顧の開示の範囲で		
4.	明細書	下記の <b>書類が削除された。</b> 第 第 図面の第	ページ 項	-ジ <b>/</b> 図		
5.	れるので、	・備審査報告は、補充欄にえ その補正がされなかった。 らける判断の際に考慮しなら	ものとして作成した	:。(PCT規則70.2(c)	が囲を越えてされたものと認めら この補正を含む差し替え用紙は上	

様式PCT/IPEA/409 (第I欄) (1998年7月)

V. 新規性、進歩性又は 文献及び説明	産業上の利用可能性についての法第12条(PCT 	35条(2)) に定める見解、それを裏付ける 
1. 見解		·
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	
· 進歩性 (IS)	請求の範囲 請求の範囲	
産業上の利用可能性(	I A) 請求の範囲 請求の範囲	, 

## 2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献 1: JP 64-44403 A (富士通株式会社) 1989.02.16 文献 2: JP 2002-156548 A (京セラ株式会社) 2002.05.31 文献 3: JP 2002-40293 A (京セラ株式会社) 2002.02.06 文献 4: EP 760488 A1 (NGK Insulators, Ltd.) 1997.03.05 文献 5: JP 8-19878 A (株式会社リコー) 1996.01.23

請求の範囲 1-4 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献 1,3-4 と新たに引用した文献 5 とにより進歩性を有しない。

文献 1,5 の光ファイバが挿入される溝の位置決め精度を、文献 3 の【0027】段落に記載されているように  $0.05~\mu$  mとしたり、文献 1 の光ファイバが挿入される溝の平行度を、文献 4 の第 5 頁第 39-41 行に記載されているように  $0.01^\circ$  以下とすることは、当業者にとって容易である。

請求の範囲 5-8 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献 1-4 と新たに引用した文献 5 とにより進歩性を有しない。

文献 1,5 に記載された光ファイバが挿入される溝をレーザ照射により穿設する際、 文献 2 の【0036】段落や文献 3 の【0033】段落に記載されているように、レーザを間 欠的に照射すること、すなわち、パルス状に照射することは、当業者にとって容易で ある。また、文献 2 の請求項 5、【0015】段落や文献 3 の請求項 8、【0029】、【003 9】段落に記載されているように、レーザ加工により形成された溝の内壁をエッチン グ処理することも、当業者にとって容易である。